



Использование патентной аналитики при реализации НИОКР и выборе направлений технологического развития

Старостин Антон Олегович Специалист Центра интеллектуальной собственности УрФУ

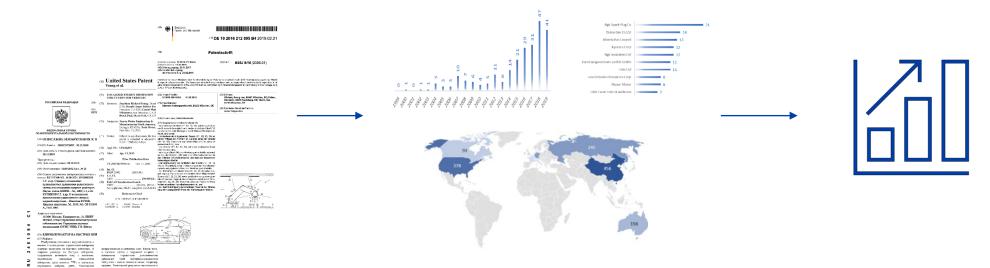






Патентная аналитика – совокупность методов, техник, инструментов и измерений, позволяющих исследовать направления научно-технологического развития, на основе патентной информации*

Патентная аналитика – обработка, визуализация и интерпретация количественных и качественных данных патентной информации







Патентная аналитика является одной из форм технологической конкурентной разведки. Используется для мониторинга и оценки рыночной и технологической среды*

Патентная аналитика - инструмент поддержки принятия решений







Актуальность

- Возрастающая цена ошибки при выборе неверного направления инновационного/технологического развития
- Желание в эпоху формирования нового технологического уклада найти свой «голубой океан»
- Растущий объем информации и сложность поиска поиска нужной информации

Патентная аналитика позволяет снизить уровень неопределенности и «цены ошибки» и становится важным инструментом при принятии стратегических управленческих решений в области инновационно-технологического развития

\$**657,9** млн 2019 \$**1657,9** млн 2027





Продукты Решаемые задачи Выявление перспективных направлений развития, Исследование отраслевых патентных и свободных ниш технологических ландшафтов Выявление рынков сбыта продукции, конкурентный технологический бенчмаркинг анализ, поиск партнеров, выход на международный рынок анализ мировых, региональных и Выявление недостающих компетенций, усиление отраслевых технологических трендов позиций предприятия в отрасли конкурентный анализ (ключевые Мониторинг состояния отрасли, выявление патентообладатели, патентные портфели, конкурентов и рисков на этапе аванпроектов и НИОКР патентные барьеры рынка) Бенчмаркинг продуктов и технологий Оценка конкурентной позиции компании и продукта Анализ корпоративных патентных профилей Оценка патентных барьеров входа на рынок





Как работаем мы?

Алгоритм работы

Постановка целей, задач, глубины и границ исследования Описание объекта области отчета

Дополнительные источники информации

- Библиографический анализ
- Новостные источники
- Отраслевые журналы и материалы конференций
- Аналитические отчеты
- Государственные и региональные программы и др. документы
- Экспертные мнения
- Сайты компаний, годовые отчеты

•••





Некоторые решаемые задачи в рамках НИОКР

Задачи Данные

Выбор направления и обоснование актуальности

Лучшие решения

Анализ конкурентов и поиск партнеров

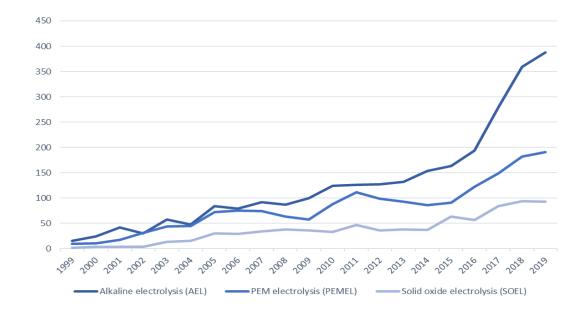
- Тренды патентования (динамика изобретательской активности; распределение патентных документов по основным рубрикам МПК и динамика патентования)
- География патентования
- Субъекты патентования
- Анализ карты цитирования
- Анализ уровня техники (в т.ч. семейства, имеющие наибольшее количество публикаций; семейства, имеющие наибольшее количество цитирований)
- Анализ возможных конкурентов партнеров (динамика, география, решения по исследуемому направлению, их распределение по правовому статусу)





Тренды

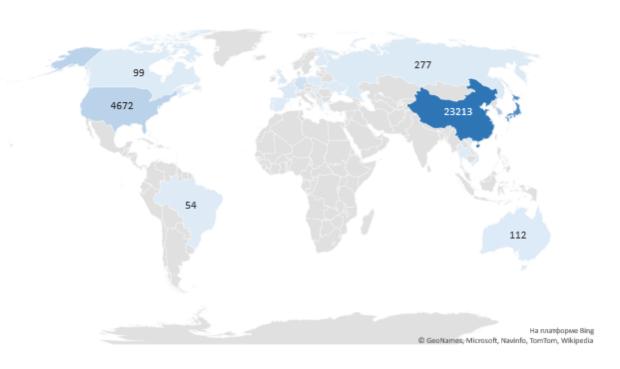


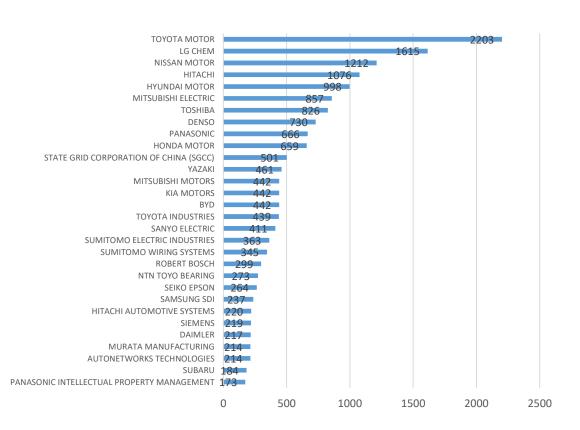






География и субъекты

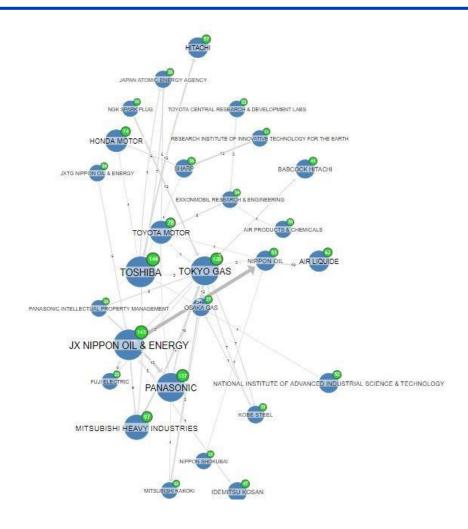








Карта цитирования





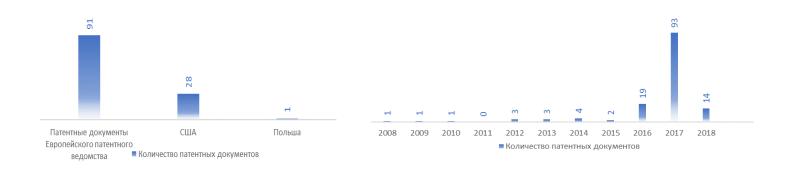


Патентный профиль компании



CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

Доход	н/д
Год основания	1945
Штаб-квартира	Париж, Франция
Число сотрудников	15000
Количество патентных семейств в коллекции	19540
Количество патентных семейств по исследуемой тематике	29
Сайт	http://www.cea.fr/









- 1. Определить: объект, ключевые слова, индексы МПК, географию и глубину поиска
- 2. Воспользоваться одним из бесплатных аналитических систем, например Patent Lens: https://www.lens.org/

Пример: гибкие OLED дисплеи

Ключевые слова: FOLED, flexible OLED

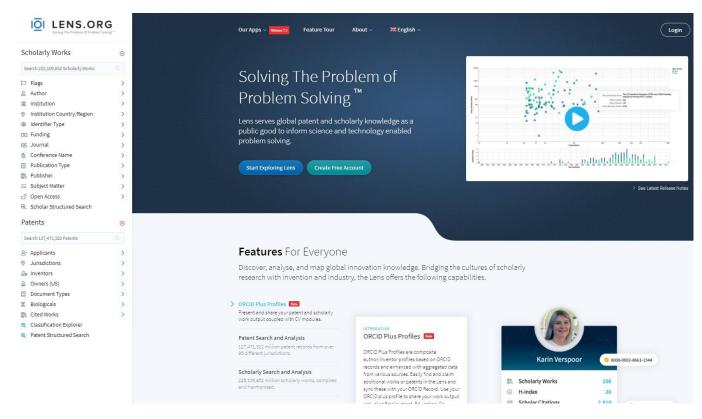
flexible light emitting diode

Индекс: H01L51/52 (конструктивные

элементы технологий OLED)

География: весь мир

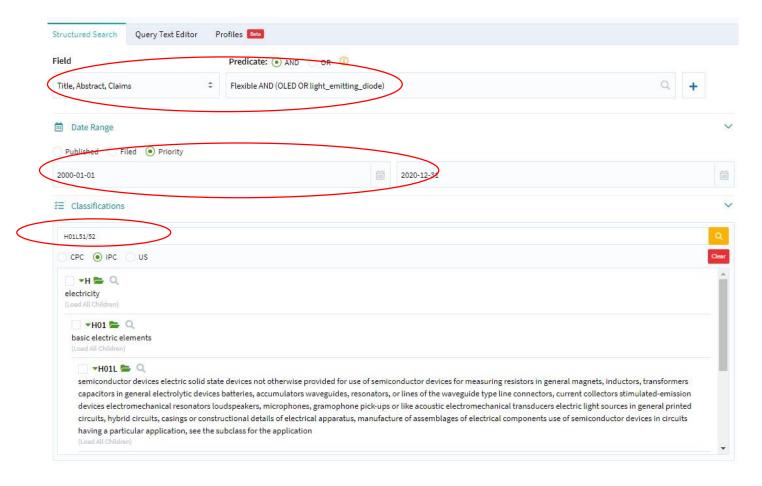
Глубина: 20 лет







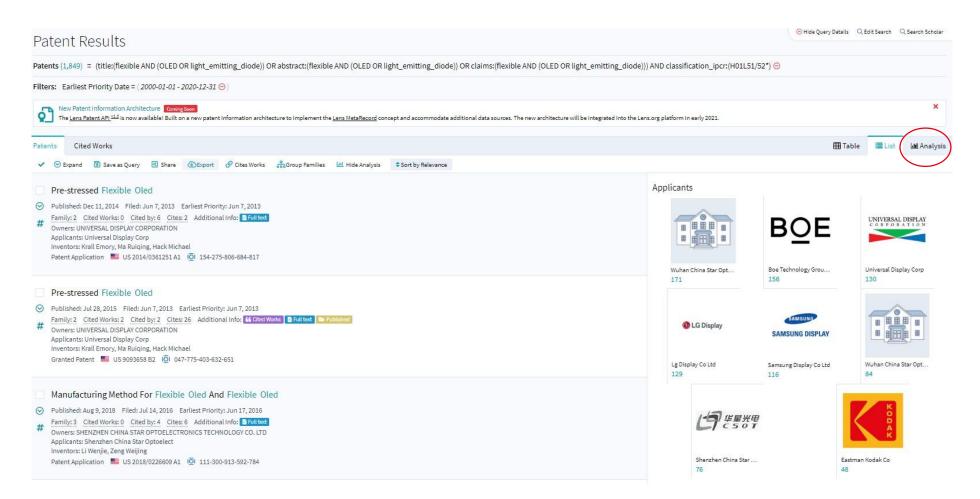
3. Заполнить поля поиска





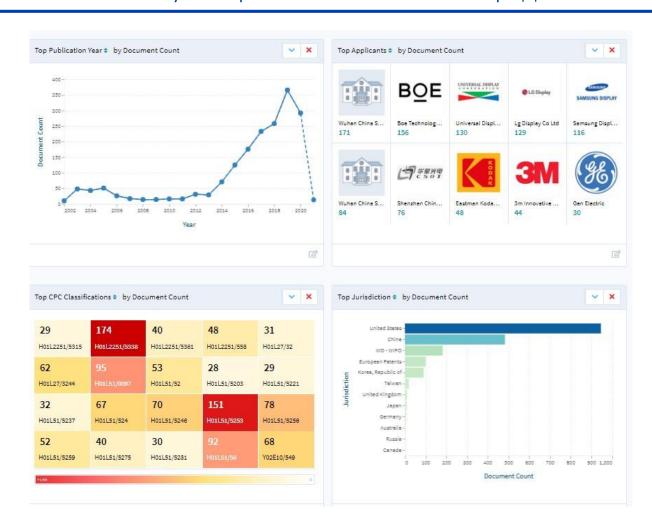


4. Выбрать аналитику













Спасибо за внимание!

Старостин Антон Олегович

a.o.starostin@urfu.ru